

This is a preview - click here to buy the full publication

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**62008**

Première édition  
First edition  
2005-07

---

---

**Caractéristiques de performance et  
méthodes d'étalonnage pour les systèmes  
d'acquisition de données numériques  
et logiciels appropriés**

**Performance characteristics and calibration  
methods for digital data acquisition systems  
and relevant software**

© IEC 2005 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch) Web: [www.iec.ch](http://www.iec.ch)



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

**X**

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## SOMMAIRE

AVANT PROPOS.....	6
INTRODUCTION.....	10
1 Domaine d'application .....	12
2 Références normatives.....	12
3 Termes, définitions, abréviations et symboles.....	14
3.1 Termes et définitions.....	14
3.2 Abréviations et symboles.....	16
4 Exigences générales .....	16
4.1 Procédures d'essai et estimation de l'incertitude de mesure.....	16
4.2 Exigences générales relatives aux MAN.....	18
4.3 Description des paramètres.....	18
4.4 Méthodes d'essai des paramètres mesurables .....	26
5 Fonctionnalité matérielle pour l'étalonnage.....	50
5.1 Information sur l'étalonnage embarqué.....	50
5.2 Matériel général d'ajustement de mesure .....	50
5.3 Matériel d'auto-étalonnage.....	52
6 Méthodes de calibrage logicielles.....	52
6.1 Interface de programmation associée d'étalonnage (API).....	52
6.2 Méthodes d'auto-étalonnage .....	52
6.3 Méthodes d'étalonnage à l'extérieur.....	54
7 Procédures relatives à l'étalonnage.....	54
Annexe A (informative) Exemples de calcul de l'incertitude système d'acquisition de données (DAQ) modulaire.....	56
Annexe B (normative) Pseudo-code pour réaliser l'essai statique par la méthode B (voir 4.4.1.2) et un exemple numérique.....	62
Annexe C (informative) Caractéristiques du module analogique numérique .....	82
Bibliographie.....	92
Figure 1 – Signal d'essai appliqué au MAN .....	30
Figure 2 – Procédure d'essai .....	34
Figure 3 – Représentation dans différentes échelles de gris des histogrammes cumulatifs calculés à chaque pas dans le cas d'un MAN 5-bits et d'un essai avec 4 pas.....	34
Figure 4 – Dispositions d'essai pour les mesures de bruit sur les Modules analogiques numériques (MAN).....	42
Figure C.1 – MAN bipolaire avec réel zéro.....	84
Figure C.2 – MAN bipolaire sans réel zéro.....	86
Figure C.3 – Erreur de décalage (spécifié au pas 000).....	88
Figure C.4 – Erreur de gain (après la correction de l'erreur de décalage) (spécifié au pas 011) .....	90

## CONTENTS

FOREWORD.....	7
INTRODUCTION.....	11
1 Scope.....	13
2 Normative references .....	13
3 Terms, definitions, abbreviations and symbols.....	15
3.1 Terms and definitions .....	15
3.2 Abbreviations and symbols.....	17
4 General requirements.....	17
4.1 Test procedures and measurement uncertainty estimation .....	17
4.2 General requirements for ADMs .....	19
4.3 Descriptions of parameters.....	19
4.4 Testing methods of measurable parameters .....	27
5 Hardware functionality for calibration.....	51
5.1 Onboard calibration information.....	51
5.2 General measurement adjustment hardware.....	51
5.3 Self-adjustment hardware.....	53
6 Software calibration methods.....	53
6.1 Calibration application programming interface (API) .....	53
6.2 Self-calibration methods .....	53
6.3 External calibration methods .....	55
7 Calibration procedures .....	55
Annex A (informative) Examples of calculation of modular DAQ system uncertainty.....	57
Annex B (normative) Pseudo-code to perform static test by method B (see 4.4.1.2) and a numerical example .....	63
Annex C (informative) ADM characteristics .....	83
Bibliography.....	93
Figure 1 – Test signals applied to the ADM.....	31
Figure 2 – Test procedure.....	35
Figure 3 – Representation in different grey tones of the cumulative histograms computed in each step in the case of a 5-bit ADM and a test with 4 steps.....	35
Figure 4 – Test arrangement for noise measurements on ADMs .....	43
Figure C.1 – Bipolar ADM with true zero .....	85
Figure C.2 – Bipolar ADM with no true zero .....	87
Figure C.3 – Offset (specified at step 000).....	89
Figure C.4 – Gain component of uncertainty (after correction of offset) (specified at step 011) .....	91

Tableau 1 – Précision des estimations du niveau de transition de code pour différentes longueurs d'enregistrement.....	28
Tableau 2 – Exemple de spécification des paramètres du module analogique numérique pour l'évaluation de l'incertitude de mesure du dispositif d'acquisition de données (DAQ).....	48
Tableau B.1 – Dérivation de l'amplitude ( $A$ ) et de l'erreur de décalage ( $C_j$ ) des petites ondes triangulaires, du nombre d'échantillons par archive ( $M$ ) et du nombre d'archives ( $R$ )..	72
Tableau B.2 – Résultats de l'essai d'histogramme et des tensions de passage correspondantes pour un MAN 5-bits testé par la méthode B en 4 pas.....	74
Tableau B.3 – Dérivation non-linéarité intégrale et Non-Linéarité Différentielle à partir des tensions de passage mesurées .....	78

Table 1 – Precision of estimates of code transition level for different record lengths .....	29
Table 2 – Example of parameters specification of ADM for measurement uncertainty estimation of DAQ device.....	49
Table B.1 – Derivation of the amplitude ( $A$ ) and offset ( $C_j$ ) of the small triangular waves, the number of samples per record ( $M$ ) and the number of records ( $R$ ).....	73
Table B.2 – Results of the histogram test and corresponding transition voltages for a 5-bit ADM tested by method B in 4 steps .....	75
Table B.3 – Deriving INL and DNL from the measured transition voltages.....	79

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

# CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE ET MÉTHODES D'ÉTALONNAGE POUR LES SYSTÈMES D'ACQUISITION DE DONNÉES NUMÉRIQUES ET LOGICIELS APPROPRIÉS

### AVANT PROPOS

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations Internationales et sont agréées comme tels par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est indispensable pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La norme internationale CEI 62008 a été établie par le Comité d'études 85: Equipement de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
85/267/FDIS	85/268/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de la présente Norme.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

# PERFORMANCE CHARACTERISTICS AND CALIBRATION METHODS FOR DIGITAL DATA ACQUISITION SYSTEMS AND RELEVANT SOFTWARE

### FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62008 has been prepared by IEC technical committee 85: Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
85/267/FDIS	85/268/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.



The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

## INTRODUCTION

Les systèmes de mesure totalement automatisés deviennent la norme pour les essais en production, en recherche et dans n'importe quel autre secteur où des mesures sont faites. L'automatisation des mesures mène à un partage étendu des données, à une communication inter-appareils, et au contrôle de la mesure à distance. Les dispositifs d'acquisition de données multifonction (DAQ) répondent à ces besoins de mesure. Ils reposent sur les techniques informatiques classiques, permettant aux développeurs de systèmes de mesure d'augmenter les normes informatiques ouvertes. Les mesures effectuées par les dispositifs DAQ sont précises et traçables. Le besoin d'intégrité de mesure exige des normes de développement non seulement pour le matériel de mesure mais également pour le logiciel qui étalonne le matériel.

## INTRODUCTION

Totally automated measurement systems are becoming the norm for manufacturing test, research and any other area where measurements are made. Measurement automation leads to extensive data sharing, inter-instrument communication and remote measurement control. Multifunction data acquisition (DAQ) devices meet these measurement needs. They rely on standard computer technology, allowing measurement systems developers to leverage open computer standards. The measurements made by DAQ devices are accurate and traceable. The need for measurement integrity requires developing standards not only for the measurement hardware but also for the software that calibrates the hardware.

# CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE ET MÉTHODES D'ÉTALONNAGE POUR LES SYSTÈMES D'ACQUISITION DE DONNÉES NUMÉRIQUES ET LOGICIELS APPROPRIÉS

## 1 Domaine d'application

La présente Norme Internationale spécifie des caractéristiques de performances et des méthodes d'étalonnage destinées aux systèmes d'acquisition de données numériques et aux logiciels appropriés, de manière à assurer que tous les systèmes de mesure basés sur des dispositifs d'acquisition de données multifonction (DAQ) répondent à une norme commune.

La présente norme couvre:

- les spécifications minimales que le constructeur du dispositif DAQ doit fournir pour décrire les performances du Module Analogique-Numérique (MAN) du dispositif DAQ.
- les stratégies d'essai normalisées pour vérifier l'ensemble minimal de spécifications.
- les informations minimales relatives à l'étalonnage, exigées par le MAN, et stockées sur le dispositif DAQ.
- les exigences minimales relatives au logiciel de calibrage pour le calibrage externe et l'auto-calibrage du MAN du dispositif DAQ.

La présente norme traite de conversion de signal de basse fréquence par exemple les applications telles que le contrôle d'usine, la mesure de vibrations, les vibro-diagnostics, les mesures acoustiques, ultrasoniques, de température, de pression, la mesure en électronique de puissance, etc.

## 2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60748-4:1997, *Dispositifs à semi-conducteurs – Circuits intégrés – Partie 4: Circuits intégrés d'interface*

CEI 60748-4-3: \_\_\_\_<sup>1)</sup>, *Dispositifs à semi-conducteurs – Circuits intégrés – Partie 4-3: Circuits intégrés d'interface – Critères dynamiques pour les Convertisseurs Analogiques Numériques (CAN)*

ISO/CEI 17025, *Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais*

BIPM, CEI, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, *Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure*

---

1) A publier.

## PERFORMANCE CHARACTERISTICS AND CALIBRATION METHODS FOR DIGITAL DATA ACQUISITION SYSTEMS AND RELEVANT SOFTWARE

### 1 Scope

This International Standard specifies performance characteristics and calibration methods for digital data acquisition systems and relevant software to ensure that all measurement systems relying on DAQ devices meet a common standard.

This standard covers:

- the minimum specifications that the DAQ device manufacturer must provide to describe the performance of the analogue-to-digital module (ADM) of the DAQ device;
- standard test strategies to verify the minimum set of specifications;
- the minimum calibration information required by the ADM that is stored on the DAQ device;
- the minimum calibration software requirements for external and self-calibration of the ADM of the DAQ device.

This standard deals with low frequency signal conversion, e.g. applications such as plant control, vibration measurement, vibro-diagnostics, acoustics, ultrasonic measurements, temperature measurements, pressure measurements, measurement in power electronics, etc.

### 2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60748-4:1997, *Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 4: Interface integrated circuits*

IEC 60748-4-3:\_\_\_<sup>1)</sup>, *Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 4-3: Interface integrated circuits – Dynamic criteria for analogue-to-digital converters (ADC)*

ISO/IEC 17025, *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*

BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)*

---

<sup>1)</sup> To be published.